

Установка измерения геометрических параметров пластин FLA-200

	Center Position		Thickness			SBID	SBIR	SF3D	SF3R	SFLD	SFLR	SFQD	
	X	Y	Center	Max	Min	Ave							
1	-35.00	-85.00	748.00	748.21	747.78	747.98	-0.22	0.43	-0.22	0.40	-0.23	0.41	0.02
2	-25.00	-85.00	748.21	748.33	748.15	748.23	0.12	0.18	0.10	0.19	0.11	0.19	-0.03
3	-15.00	-85.00	748.16	748.25	747.99	748.14	-0.17	0.26	-0.14	0.20	-0.15	0.21	-0.02
4	-5.00	-85.00	748.06	748.12	747.92	748.01	-0.14	0.20	-0.13	0.17	-0.14	0.18	0.02
5	5.00	-85.00	748.05	748.09	747.94	748.03	-0.11	0.15	-0.14	0.20	-0.14	0.21	0.03
6	15.00	-85.00	748.10	748.13	748.00	748.08	-0.10	0.12	-0.07	0.11	-0.08	0.12	-0.04
7	25.00	-85.00	747.98	748.11	747.93	748.01	0.14	0.18	0.11	0.15	0.11	0.16	0.02
8	35.00	-85.00	747.87	748.10	747.62	747.84	-0.24	0.47	-0.26	0.51	-0.27	0.52	0.03
9	-55.00	-75.00	748.45	748.66	748.28	748.44	-0.21	0.42	0.20	0.39	0.21	0.41	-0.03
10	-45.00	-75.00	748.43	748.54	748.27	748.43	-0.16	0.26	-0.14	0.22	-0.15	0.23	0.04
11	-35.00	-75.00	748.44	748.53	748.35	748.45	-0.10	0.19	0.12	0.19	0.12	0.19	-0.02

	Judgment
	NG
m	NG
n	NG
e	NG

Item	Judgment
SBID	OK
SBIR	OK
SF3D	OK
SF3R	NG
SFLD	OK
SFLR	NG
SFQD	OK
SFQR	OK

Item	Data	Judgment
SFPD%	46.01	OK
STIR%	100.00	NG

[Image](#)

Производитель:

Napson

Цена:

Цена по запросу

Описание

Измерения в данной системе производятся бесконтактным методом, что исключает разрушение рабочей поверхности пластины. Установка позволяет проводить измерение таких параметров пластин, как толщина, разнотолщинность (TTV), прогиб (BOW), коробление (WARP), локальная и глобальная плоскостность пластин в соответствии со стандартами ASTM. Система позволяет работать с пластинами диаметром до 300 мм. Измерение толщины производится в диапазоне 500 мкм без проведения повторной калибровки. Система позволяет проводить измерение 12,000 точек по поверхности в течение 1 минуты. Результаты картографирования поверхности могут быть представлены в виде 2D/3D изображений, возможен импорт данных в Excel.

Область применения:

- Измерение геометрических характеристик полупроводниковых пластин Si, poly-Si, SiC, GaAs, GaN, Ge, InP, сапфира, кварца
- Контроль поверхности пластин после технологических операций дисковой/проволочной резки слитков, шлифовки, полировки, утонения, травления

Технические характеристики:

Диаметр пластин	76, 100, 150, 200 мм 300 мм (опция)
Диапазон измерения толщины	200 – 1200 мкм, точность $\pm 0,5$ мкм
Диапазон измерения прогиба (BOW)	± 350 мкм, точность ± 3 мкм
Диапазон измерения коробления (WARP)	до 350 мкм, точность ± 3 мкм
Плоскость [локальная]	точность $\pm 0,15$ мкм, воспроизводимость 0,05 мкм
Плоскость [глобальная]	точность $\pm 0,15$ мкм, воспроизводимость 0,05 мкм
Управление	PC и специализированное ПО